44-32. Расписание сессии

Пн, 27 дек.	12:45 — 14:20	АТТ Измерения в микро- и наноэлектронике Б18-403 Рыжук Р.В.
Ср, 26 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Измерения в микро- и наноэлектронике Б18-403 Рыжук Р.В.